

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△	1 RE-F-10251	土井	小沢	05.02.02	△					
適用規格										
定格	使用温度範囲	-55℃～85℃			保存温度範囲	-10℃～60℃(注3)				
	電圧	AC 100V			使用湿度範囲	40%～80%				
	電流	0.4A			保存湿度範囲	40%～70%(注3)				
性能										
	項目	試験方法			規格			QT	AT	
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○	
	表示	目視にて確認する。						○	○	
電気的 性能	接触抵抗	100mA(DC又は1000Hz)で測定する。			80mΩ以下(注1)			○	—	
	低電圧、低電流下の 接触抵抗	20mV以下、1mA(DCまたは1000Hz)で 測定する。			100mΩ以下(注2)			○	—	
	絶縁抵抗	DC 250Vで測定する。			100MΩ以上			○	—	
	耐電圧	AC 300Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—	
機械的 性能	繰り返し動作	50回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 100mΩ以下(注2) ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
	耐振性	周波数 10～55Hz、振幅 1.5mm、 3方向各2時間試験する。			① 1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 100mΩ以下(注2)			○	—	
	耐衝撃性	加速度 490m/s ² 、持続時間 11ms、 正弦半波 3方向各3回試験する。			③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96時間放置する。			① 接触抵抗: 100mΩ以下(注2) ② 絶縁抵抗: 100MΩ以上			○	—	
	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→2→3→30→2→3分 を5サイクル試験する。			③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—	
	塩水噴霧	濃度 5%の塩水、48時間放置する。			① 接触抵抗: 100mΩ以下(注2)			○	—	
	硫化水素	濃度 3ppm、96時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)			② はなはだしい腐食がないこと。			○	—	
	はんだ耐熱性	リフローの場合: ピーク温度 MAX250℃ 220℃以上 60秒以内			外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。			○	—	
		はんだごての場合: こて温度 360℃ △ はんだ付け時間 5秒以内						○	—	
	はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 3秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の95%以上が 新しいはんだでぬれていること。			○	—	
備考										
注1. 本製品のスタッキング高さ16mmタイプでの導体抵抗を考慮し、接触抵抗の 初期値を80mΩとする。					製図	担当	検図	承認	出図	
注2. 試験後、初期値からの変化量が20mΩ以下のこと。					HIF 04.03.22 中村	HIF 04.03.22 中村	HIF 04.03.23 山口	HIF 04.03.23 大川		
注3. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。 試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。										
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目										
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					製品規格表			製品名 FX8C-※※P-SV4(71)		
IBCL CL		図番 SLC4-151089-25			製品コード CL578			1 1		

